

Материалы электроники

<i>Федянина М.Е., Лазаренко П.И., Воробьев Ю.В., Козюхин С.А., Дедкова А.А., Якубов А.О., Левицкий В.С., Сагунова И.В., Шерченков А.А.</i> Влияние степени кристалличности на дисперсию оптических параметров тонких пленок фазовой памяти $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$	203
--	-----

Элементы интегральной электроники

<i>Смирнов В.И., Сергеев В.А., Гавриков А.А., Куликов А.А.</i> Сравнительный анализ методов измерения теплового сопротивления нитрид-галлиевых НЕМТ-транзисторов.....	219
---	-----

Схемотехника и проектирование

<i>Иванов Е.А., Якунин А.Н.</i> Цифровая схема коммутации силовых ключей источников питания в квазирезонансном режиме.....	234
<i>Тимошенко А.В., Калеев Д.В., Перлов А.Ю., Антошина В.М., Рябченко Д.В.</i> Сравнительный анализ аналитических и эмпирических методик оценки текущих параметров надежности радиолокационных комплексов мониторинга.....	244

Биомедицинская электроника

<i>Базаев Н.А.</i> Особенности построения автономной носимой аппаратуры искусственного очищения крови.....	255
--	-----

Информационно-коммуникационные технологии

<i>Шепилова К.М., Сотников А.В., Шипатов А.В., Савченко Ю.В.</i> Метод трехмерной реконструкции сцены в относительных координатах по двум изображениям с неоткалиброванных видеокамер.....	265
--	-----

Краткие сообщения

<i>Никифоров М.О., Дедкова А.А., Рыгалин Б.Н.</i> Влияние технологических параметров процесса атомно-слоевой эпитаксии на однородность толщины зародышевых слоев GaN	277
<i>Головлев А.А., Березина Н.В., Кондратьева О.В., Кольцов В.Б.</i> Оценка эффективности мероприятий по снижению накопления полиэтиленовых отходов в окружающей среде на основе информатической модели.....	282

Юбилей

Сигову Александру Сергеевичу – 75 лет.....	287
Неволину Владимиру Николаевичу – 75 лет.....	288

Конференции

27-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2020».....	289
IX Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем» (МЭС-2020).....	290
К сведению авторов.....	291